奈良先端科学技術大学院大学　ナノテクノロジープラットフォーム

けいはんな地域の研究機関、特に、中小・ベンチャー企業を積極的に支援します

支援件数

	支援件数	大学他	企業
24年度	34件	23件	11件
25年度	37件	22件	15件
26年度	47件	22件	25件
27年度	58件	36件	22件

利用形態と利用料金例

利用形態	利用区分	大学利用料	企業利用料
技術相談	一般利用	**無料**	**無料**
協力研究	四半期	**27,000 円**	**54,000 円**
技術代行/機器利用	1日利用	**5,400 円**	**10,800 円**

支援期間：4月－12月、協力研究は4－6月、7－9月、10－12月の四半期単位、

主な支援機器

透過型電子顕微鏡　日本電子，JEM-3100FEF
粉末X線回折装置　リガク，RINT-TTRIII/NM
単結晶X線回折装置　リガク，ValiMax RAPID RA-Micro7
X線散乱測定装置　リガク，Micro/Max-007HF
多機能走査型X線光電子分光分析装置　アルバック・ファイ，PHI5000 Versa Probe Ⅱ
MALDI-TOF質量分析装置 Bruker Daltonics，Autoflex II
分光感度・内部量子効率測定装置 分光計器，CEP-2000RR
大気中光電子分光装置 理研計器，AC-3
熱電特性評価装置 カンタム・デザイン，PPMS EverCool II

支援試行機器　（下記の機器も適宜ご利用いただけます、詳細は連携マネージャーにご相談ください。）

電子線マクロアナライザ（EPMA） 島津，EPMA1610
二次イオン質量分析（SIMS）装置 ULVAC-PHI，ADEPT-1010
600MHz超伝導NMR JEOL，JNM-ECA600
400MHz固体超伝導NMR JEOL，JNM-ECX400
全自動元素分析装置 Perkin Elmer，2400 Ⅱ CHNS/O
二重収束型質量分析計（EI，CI，FAB） JEOL，JMS-700
ESI専用飛行時間型質量分析計（TOF-MS） JEOL，JMS-T100LC
MALDI-Spiral-TOF質量分析装置 JEOL，JMS-S3000
示差走査熱主計・示差熱熱主量同時測定装置
日立ハイテクサイエンス DSC/TG-DTA 6200
複合型表面組成分析装置（XPS/AES） 島津，KRATOS AXIS-165
電界放射型走査電子顕微鏡（FE-SEM） JEOL，JMS-7400F，JED-2200
走査型プローブ顕微鏡（SPM） 日立ハイテクサイエンス，SPA400，SPI-3800N
微細形状測定機 小坂研究所，ET200
分光エリプソメーター HORIBA JOBIN YVON，UVISEL ER AGMS-NSD
顕微レーザーラマン分光光度計 日本分光，NRS-4100-30
円二色性分散計（CD） 日本分光，J-725
フェムト秒，サブナノ秒パルスレーザー・蛍光寿命測定装置 Coherent Mira，宇翔KEC-160，浜松ホトニクスC4780
ダイナミック光散乱光度計 大塚電子，DLS-6000
電子スピン共鳴（ESR）装置 JEOL，JES-FA100

問い合わせ：奈良先端科学技術大学院大学　物質科学教育研究センター　NAIST ナノテクノロジープラットフォーム事務局
戸所義博　高下泰子　E-mail: nano-jimu@ms.naist.jp　Phone: 0743-72-6185
ホームページ　http://mswebs.naist.jp/nanopla/